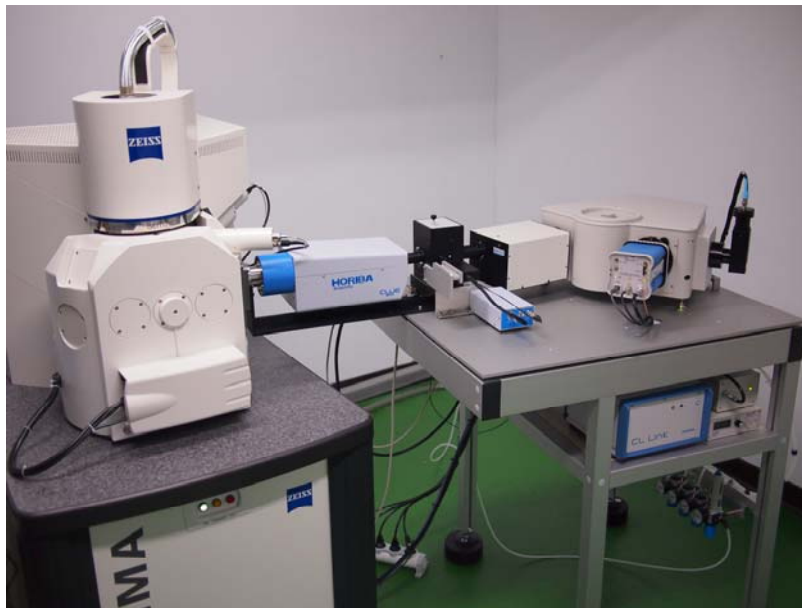


CL 與 EELS 技術研討會

陰極螢光光譜術(Cathodoluminescence Spectroscopy)與電子損失能譜光譜術(Electron Energy Loss Spectroscopy)能精確分析材料中微區的缺陷與電子結構，是奈米材料與科技研究最重要的分析技術之一。本校理學院為提升奈米材料與科技研究能量，新近添購陰極螢光光譜儀(CL)與電子損失能譜光譜儀(EELS)，並成立理學院貴重儀器中心。

為推廣陰極螢光光譜儀(CL)與電子損失能譜光譜儀(EELS)之應用，特地邀請國內外知名專家學者，演講有關陰極螢光光譜儀(CL)與電子損失能譜光譜儀(EELS)之原理與應用及最新發展技術。



活動對象：CL 與 EELS 使用者

活動時間：中華民國 101 年 6 月 8 日(星期五)上午 9 時至下午 4 時 40 分

活動地點：淡江大學淡水校園鍾靈化學館 C013 教室

報名時間：即日起至 6 月 1 日(五)中午 12 時止

報名人數：限 100 人，額滿為止

報名方式：進入淡江大學網頁→活動報名系統(首頁下方)→查詢類別:研討會
(擇一即可) →活動名稱:CL 與 EELS 使用者，即可進行報名

亦可直接點選下列網址：

<http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=TSPX20120608>

報名費用：免費（提供講義及午餐）

連絡方式：1. 承辦人：淡江大學物理系辦公室 吳靜怡小姐

2. 電子信箱：phys@mail.tku.edu.tw

3. 電話：(02)2621-5656 轉 2521 或 2578 傳真：(02)2620-9917

活動流程：

時 間	演 講 者	講 題
8:50-09:00	報 到	
9:00-09:10	王伯昌 院長 淡江大學理學院院長	理學院貴重儀器中心簡介
9:10-10:10	Dr. Uwe Jahn 德國: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, Berlin	陰極螢光光譜儀(CL)的在奈米半導體的 應用
10:10-10:40	休息及討論	
10:40-11:40	陳貴賢 教授 中央研究院原子與分子科 學研究所	陰極螢光光譜儀(CL)在奈米氧化物及氮 化物的應用 "CL analysis for nitride and oxide nanomaterials"
11:40-12:10	Mr Henry Cai 德國: Application Manager Materials, Carl Zeiss Microscopy Business Group	FIB-SEM 在奈米製作(nanofabrication)上 之應用
12:00-13:00	午 餐	
13:00-14:00	Dr. Zhang Liang 美國: Application Scientist, Gatan.Inc	電子損失能譜光譜儀(EELS)分析技術的最 新發展
14:00-14:30	休息及討論	
14:30-15:30	張 立 教授	電子損失能譜—基礎物理與科技

	交通大學材料科學與工程學 系	
15:30-16:30	羅聖全 博士 工業技術研究院材料與化 工研究所	電子損失能譜(EELS)與能譜影像 (Spectrum-Imaging)之應用
16:30-16:40	王伯昌 院長	結語(贈送紀念品)